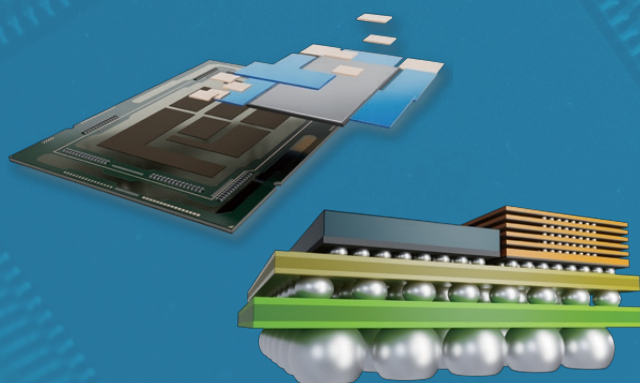


반도체 패키징용 고속/고해상도 CT-X선 검사 장치

VT-X950



VT-X950는 고속 CT 이미지로 품질을 가시화하여
반도체 생산 공정을 혁신합니다

고속 CT 촬영

불량 특성의
정량적 정의

용도에 따른
유연한 활용

Industrial Web ▶ <http://www.ia.omron.co.kr>

한국 오므론 제어기기 주식회사

서울특별시 서초구 강남대로 465, B동 18층(서초동, 교보타워)

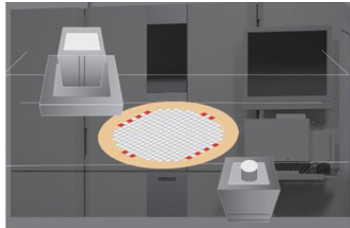
TEL: 1522-8994 FAX: 02-3483-7788

V T-X950은 반도체의 연구 개발 단계부터 양산 초기, 안정 단계에 이르기까지 고객의 과제에 대한 솔루션을 제안합니다.

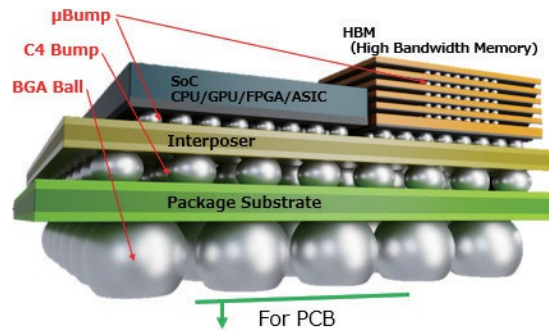
연구 개발: 분석기와 결합하여 "출현률" 향상

반도체를 비파괴·단층 절단하지 않고, 솔더의 접합 상태를 정량적으로 자동 검사할 수 있습니다

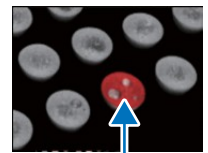
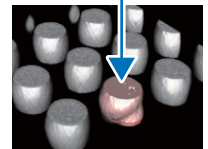
고속 CT 촬영 자동 양폐 판정



품질 변화가 발생하기 쉬운 부분
확인



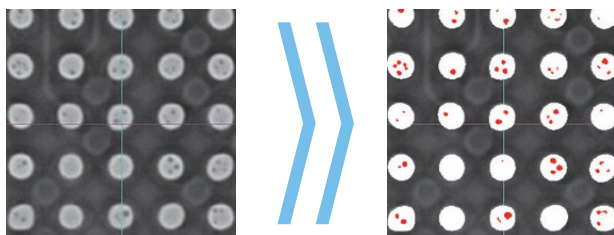
납땜 형상 NG



보이드 NG

양산 초기: 촬영 및 정량 데이터 획득의 고속화로 "수율" 개선

정의된 기준에 따른 고속 자동 검사

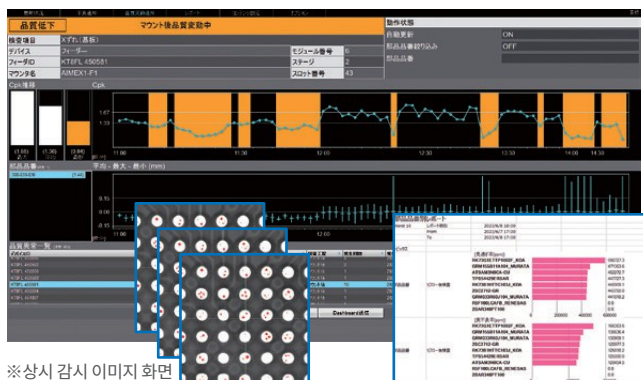


불량품 기준을 정량적으로 정의

☒ Void	Measurement value	Result
☒ Void ratio 5 %	12%	NG
☒ %	8%	OK
☐ μm		

양산기: 안정적으로 양품 생산이 이루어지고 있는지 "실시간 모니터링"

생산 조건이 준수되고 있는지 상시 모니터링



생산 조건의 조기 시정

